


**ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR CALIBRATION LABORATORY
Nr/No. AP 195**

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 1 z/of 09.06.2021

 <p style="text-align: center;">AP 195</p>	<p style="text-align: center;">Nazwa i adres / Name and address</p> <p style="text-align: center;">BAJOR METROLOGY Piotr Bajor ul. Skłodowskiej-Curie 6/6 77-400 Złotów LABORATORIUM WZORCUJĄCE ul. Wańkowicza 9 77-400 Złotów</p>
<p>Działalność prowadzona / Activity conducted</p> <p>w stałej lokalizacji (S) / at permanent location (S)</p>	<p>Wzorcowanie / Calibration: Numer i nazwa wielkości mierzonej / number and name of mesurand^{*)}</p> <p>6.01 długość</p>

Wersja strony/Page version: A

^{*)} Numeracja wielkości mierzonych zgodna z podaną w załączniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

**KIEROWNIK
BIURA ds. AKREDYTACJI**

TADEUSZ MATRAS

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 195 z dnia 09.06.2021 r.
Cykl akredytacji od 09.06.2021 r. do 08.06.2025 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No. AP 195 of 09.06.2021
Accreditation cycle from 09.06.2021 to 08.06.2025
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

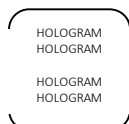
Laboratorium Wzorcujące ul. Wańkowicza 9, 77-400 Złotów				
Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Długość				
plytki wzorcowe (klasy 0, 1, 2)	(0,5 ÷ 100) mm	$\sqrt{(0,052)^2 + (0,0014)^2 \cdot l_n^2} \mu\text{m}$ gdzie l_n w mm	S	IW-3.1-BM (przy użyciu płytek kl. K jako odniesienie)
plytki wzorcowe (klasy 0, 1, 2)	(0,5 ÷ 150) mm	$\sqrt{(0,074)^2 + (0,0018)^2 \cdot l_n^2} \mu\text{m}$ gdzie l_n w mm		IW-3.1-BM (przy użyciu płytek kl. 0 jako odniesienie)
pierścienie wzorcowe	(4 ÷ 150) mm	$\sqrt{(1,18)^2 + (11,4)^2 \cdot l_n^2} \mu\text{m}$ gdzie l_n w mm		IW-4.1-BM
sprawdziany tłoczkowe	(1 ÷ 150) mm	$\sqrt{(1,22)^2 + (14,4)^2 \cdot l_n^2} \mu\text{m}$ gdzie l_n w mm		IW-4.1-BM (przy użyciu długościomierza)
sprawdziany tłoczkowe	(1 ÷ 25) mm	1,0 μm		IW-4.1-BM (przy użyciu mikrometru o rozdż. 0,1 μm)
waleczki pomiarowe	(0,1 ÷ 25) mm	1,0 μm		IW-4.1-BM (przy użyciu mikrometru o rozdż. 0,1 μm)
czujniki analogowe o wartości działki elementarnej - 0,01 mm - 0,001 mm	(0 ÷ 50) mm (0 ÷ 100) mm (0 ÷ 5) mm	1,0 μm 1,2 μm 0,74 μm		IW-11.1-BM (przy użyciu OPTIMAR 100)
czujniki cyfrowe o rozdzielczości - 0,01 mm - 0,001 mm - 0,0005 mm	(0 ÷ 50,8) mm	1,0 μm 0,74 μm 0,74 μm		IW-11.1-BM (przy użyciu OPTIMAR 100)
czujniki analogowe z uchylnym trzpieniem o wartości działki elementarnej - 0,01 mm - 0,002 mm - 0,001 mm	(± 1,6) mm (± 0,6) mm (± 0,14) mm	1,0 μm 0,74 μm 0,74 μm		IW-11.3-BM (przy użyciu OPTIMAR 100)
średnicówki czujnikowe dźwigniowe z czujnikiem o wartości działki elementarnej - 0,01 mm - 0,001 mm	(18 ÷ 600) mm	1,1 μm 0,81 μm		IW-13.2-BM (przy użyciu OPTIMAR 100)
suwmiarki - rozdzielczość 0,01 mm - wartość działki elementarnej 0,02 i 0,05 mm - wartość działki elementarnej 0,1 mm	(0 ÷ 1000) mm	$\sqrt{(0,014)^2 + (0,047)^2 \cdot l_n^2}$ mm $\sqrt{(0,017)^2 + (0,047)^2 \cdot l_n^2}$ mm $\sqrt{(0,027)^2 + (0,047)^2 \cdot l_n^2}$ mm gdzie l_n w m		IW-9.1-BM
głębokościomierze suwmiarkowe - rozdzielczość 0,01 mm - wartość działki elementarnej 0,02 i 0,05 mm - wartość działki elementarnej 0,1 mm	(0 ÷ 500) mm	$\sqrt{(0,014)^2 + (0,054)^2 \cdot l_n^2}$ mm $\sqrt{(0,017)^2 + (0,054)^2 \cdot l_n^2}$ mm $\sqrt{(0,027)^2 + (0,094)^2 \cdot l_n^2}$ mm gdzie l_n w m	IW-9.2-BM	
wysokościomierze suwmiarkowe - rozdzielczość 0,01 mm - wartość działki elementarnej 0,02 i 0,05 mm - wartość działki elementarnej 0,1 mm	(0 ÷ 1000) mm	$\sqrt{(0,014)^2 + (0,047)^2 \cdot l_n^2}$ mm $\sqrt{(0,017)^2 + (0,047)^2 \cdot l_n^2}$ mm $\sqrt{(0,027)^2 + (0,047)^2 \cdot l_n^2}$ mm gdzie l_n w m	IW-9.3-BM	
mikrometry zewnętrzne - wartość działki elementarnej 0,01 mm - rozdzielczość 0,001 mm - rozdzielczość 0,0001 mm	(0 ÷ 600) mm (0 ÷ 600) mm (0 ÷ 25) mm	$\sqrt{(1,28)^2 + 14^2 \cdot l_n^2} \mu\text{m}$ $\sqrt{(0,78)^2 + 14^2 \cdot l_n^2} \mu\text{m}$ gdzie l_n w m 0,6 μm	IW-10.1-BM	
sprawdziany gwintowe trzpieniowe walcowe	(2 ÷ 50) mm	3,2 μm	IW-4.8-BM	
szczelinomierze listkowe	(0,02 ÷ 2,00) mm	1,6 μm	IW-31.1-BM	

Wersja strony: A

Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 %. Niepewność pomiaru dla CMC wyrażona jest w jednostkach wielkości mierzonej.

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AP 195

Status zmian: wersja pierwotna – A



Zatwierdzam status zmian

**KIEROWNIK
BIURA ds. AKREDYTACJI**

TADEUSZ MATRAS
dnia: 09.06.2021 r.